Se	earch Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/710,421	SHEI ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Joseph Nguyen	2815	

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
257	99,79	7/26/2005	JN
257	90	7/26/2005	JN
4. • • • • • • •			
		·	

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		·	

SEARCH (INCLUDING SEAF	NOTES RCH STRATE	SY)
	DATE	EXMR
Search history printout	7/26/2005	NL 6
<u> </u>		
,		
· .		